

ADVANTEST in our Lives



アドバンテストの「はかる」技術は、暮らしの「快適」と「安全・安心」を支えています



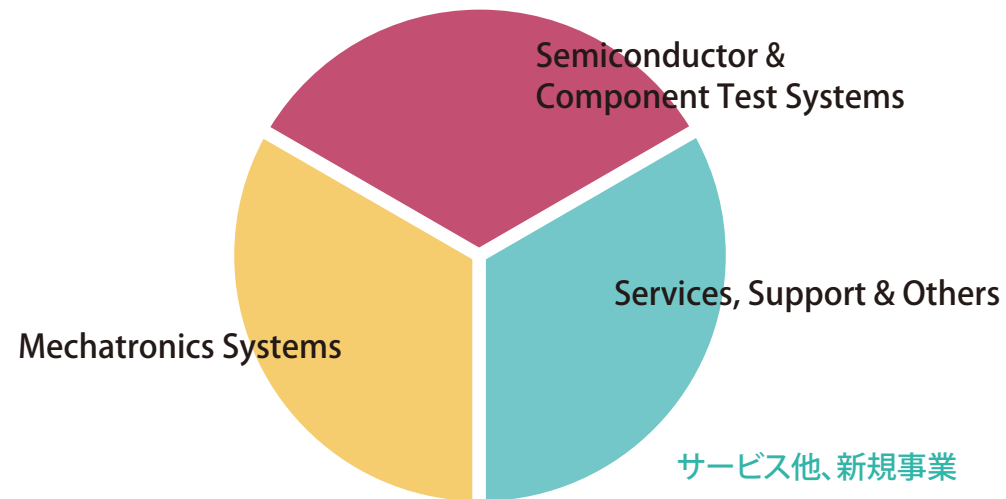
事業セグメント

先端技術を先端で支える

アドバンテストは創業以来、「計測」を事業の軸とし、暮らしの安全と安心を支えてきました。お客さまにご満足いただける技術・商品・サービスを提供するために、たえず自己研鑽に励み、最先端の技術開発を通じて社会の発展に貢献していきます。

半導体・部品テストシステム事業

主力製品の半導体テスト・システムは、高い生産性と、さまざまな品種のデバイスに対応したカバレッジの広さで多くのお客様に支持され、世界トップクラスの市場シェアを獲得しています。



メカトロニクス関連事業

テスト工程の効率的な運用に欠かせないテスト・システム周辺機器や最先端デバイスの開発・製造に貢献するナノテクノロジー製品でお客様の半導体ビジネスを多方面からサポートします。

サービス他、新規事業

システム立ち上げやメンテナンス・サービスから、稼働率向上アプリケーションなどの高付加価値ソリューションまで、世界各地の拠点からお届けしています。また、これまで培ってきた技術を新しい分野にも展開し、画期的な製品による新たな市場の創出に挑戦しています。

半導体・部品テストシステム事業

■ 半導体テスト・システム

半導体に信号を入力後、出力信号を測定して良品／不良品判定を行います。半導体の品種に応じて、機能を特化したシステムが使われています。

非メモリテスト・システム

マイクロ・プロセッサ、アプリケーション・プロセッサ、通信IC、パワー半導体など、多種多様な非メモリ半導体の試験に柔軟に対応するため、ボード交換によってシステム構成を変更できるモジュール構造を採用しています。

また、スマートフォンのタッチパネルや、液晶テレビのディスプレイをコントロールする半導体であるディスプレイ・ドライバIC向けテスト・システムは、世界各地に1,500台以上のインストール・ベースを有する業界標準機です。



V93000



T2000



T6391

メモリ・テスト・システム

DRAMやフラッシュ・メモリなどのメモリ半導体を高品質、高速かつ多数個同時にテストし、お客様の生産性向上に貢献します。



T5503HS



T5833

■ EVA (Evolutionary Value Added Measurement System)

アナログ、センサ、ミクスドシグナルICなどさまざまな電子デバイスの、開発から量産までを強力にサポート。プログラム言語不要の直観的な操作性、優れた測定精度とシステム拡張性と、半導体試験装置と電子計測器双方のメリットを兼ね備えた装置です。



EVA100

■ 電子計測器

2系統の高周波信号の位相を1台で同期測定可能なクロス・ドメイン・アナライザをはじめ、スペクトラム・アナライザ、ボード・ネットワーク・アナライザなどのRF計測器をラインアップ。電波特性の検証や電子機器のノイズ対策など、幅広い産業用途で活躍します。



U3800シリーズ

■ バーンイン・システム

半導体に熱的、電氣的なストレスを加えて初期故障をスクリーニングし、不良品の流出を未然に防ぐためのシステムです。



B6700

メカトロニクス関連事業

■ テスト・ハンドラ

パッケージされた半導体をテスト・システムに高速搬送し、テスト結果に従って良品／不良品を自動分別します。テストの温度条件に応じて高温／低温を広範囲で管理する機能も備えています。



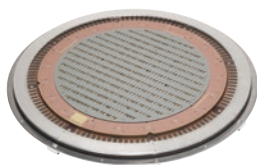
M6245



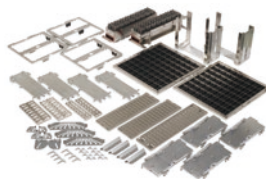
M4871

■ デバイス・インタフェース

品種によって形状や仕様が異なる半導体を、テスト・システムに高精度で電氣的、機械的に接続する治具の総称です。



プローブ・カード



チェンジ・キット

■ MVM-SEM®

電子ビームを用いて、半導体ウエハやフォトマスクに描かれた微細なパターンの幅、高さ、側壁角度などを3次元でリアルタイムに非破壊測定する走査型電子顕微鏡です。



E3640



E3310

*MVM-SEM® = Multi Vision Metrology Scanning Electron Microscope
(多次元観察・測長走査型電子顕微鏡)

※MVM-SEMIは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ EB露光装置

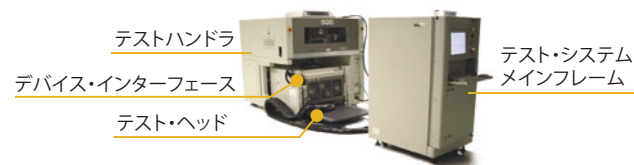
電子ビームを用いて、1Xnmノードの最先端半導体プロセスに求められる微細なパターンを、半導体ウエハなどに直接描画します。



F7000

テスト・セル

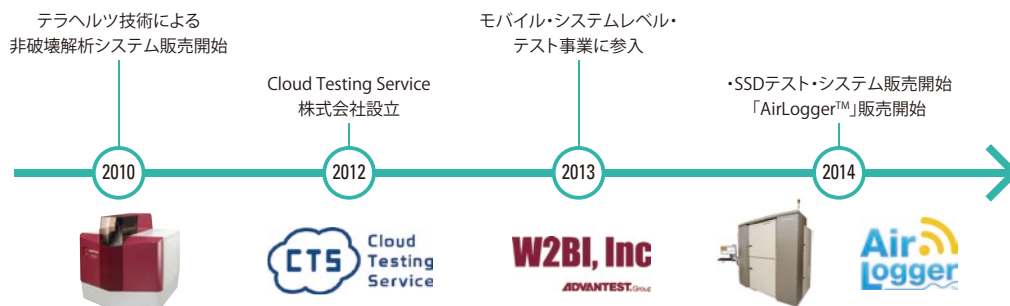
アドバンテストは、「テスト・システム」「テスト・ハンドラ」「デバイス・インタフェース」の全てを1社で供給することができます。これらを統合した「テスト・セル・ソリューション」は、業界最高レベルのテスト品質およびテスト効率が評価され、多くのお客様に導入されています。



サービス他、新規事業

アドバンテストの新規事業

アドバンテストは、会社の一層の成長に向けて、中長期的な視点による新たな事業の育成に取り組んでいます。既存事業の枠を超えてライフサイエンスやエネルギーなどの成長分野にも挑戦し、さまざまな社会課題の解決に貢献する革新的な技術・製品の実現を目指しています。



■ SSDテスト・システム

データトラフィック量の増大にともない、ハイエンド・データサーバの普及が拡大しています。それに伴い増産が見込まれる産業用SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）向けのシステムレベル・テスト・システムです。



MPT3000

■ テラヘルツ分光・イメージング解析システム

テラヘルツ波を用いて、超音波や赤外線などの従来技術では困難な物質を非破壊で解析します。医薬品や先端半導体など多くの分野に新たな評価手法を提案します。



TAS7500シリーズ

■ AirLogger™

測定ユニットから温度データを無線で通信することにより、測定前のケーブル接続作業を不要とし作業効率を大幅にアップ。密閉空間や回転体も容易に測定できます。



AirLogger 温度測定ユニット

回転体での測定例

■ ワイヤレス・システムレベル・テスト*

スマートフォンなどのモバイル機器が、地域や通信キャリアといったさまざまな環境下で正しく動作するかどうかを汎用的に検証するソフトウェアです。



紹介ムービー

(クリックすると別ウインドウが開きます)

* 米子会社W2BI社より提供いたします

■ CloudTesting™ Service*

好みの半導体の測定・解析プログラムを、インターネットからユーザのパソコンにダウンロードし、必要な分だけ月額ライセンスで利用できるサービスです。専用の測定端末は無償でレンタル。半導体設計や、大学などの専門教育に最適です。



CloudTesting™ Station

* 子会社Cloud Testing Service株式会社より提供いたします